# Синтез и электропроводность нового суперионного соединения Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>

© А.Г. Миколайчук, Н.В. Мороз, П.Ю. Демченко

Львовский национальный университет им. И. Франко, Львов, Украина

E-mail: riv018@i.ua

(Поступила в Редакцию 20 мая 2009 г.)

Изучены условия синтеза нового соединения  $Ag_6SnS_4Br_2$ . Определены кристаллографические параметры элементарной ячейки: пространственная группа *Pnma*, a = 6.67050(10), b = 7.82095(9), c = 23.1404(3) Å, Z = 4. На постоянном токе зондовым методом в интервале температур 210–380 К проведены измерения полной электропроводности и ее ионной составляющей. Зафиксирован излом на кривой электропроводности и дифференциальной термограмме нагрева сплава при 235 К. Сделан вывод о внутризеренном характере массо- и электропереноса в спрессованном порошкообразном сплаве  $Ag_6SnS_4Br_2$ .

#### 1. Введение

В системах Ag-X-Y-Z (X = Si, Ge, Sn; Y = S, Se; Z = Cl, Br, I) образуются соединения Ag<sub>7</sub>XY<sub>5</sub>Br(I) (кубическая пространственная группа  $F\bar{4}3m$ , Z = 4), структурные аналоги минералов аргиродита [1–3]. Они являются суперионными проводниками с числами переноса по катионам серебра, равными единице. Соединениям свойственна неаррениусова зависимость электопроводности от температуры [2,4,5]. Имеется сообщение об образовании в указанных системах соединений иного формульного состава. Автор [6] вырастил гидротермальным методом кристаллы Ag<sub>6</sub>GeS<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> и Ag<sub>6</sub>GeS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> (ромбическая пространственная группа Pnma, Z = 4). Кристаллы разлагаются в вакууме выше 430 и 530 К соответственно. Указанные соединения находятся в плоскости политермического разреза  $Ag_8XY_6 - [(AgZ)_4 \cdot XY_2]$ квазитройных систем  $Ag_2X - YX_2 - AgZ$ .

Предварительно проведенный нами синтез смеси соединений  $Ag_8SnS_6 + SnS_2 + 4AgBr$  в вакуумированном контейнере при 700 К в течение 24 h указывает на образование тетрарного соденинения Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>. Охлажденный до 300 К со средней скоростью 8 К/min кварцевый контейнер со сплавом содержит на стенке кристаллические серу и SnBr<sub>2</sub>, а также жидкость из смеси серы, бромидов серы и олова (~ 2-3 mass.%). Рентгенограмма от основной части сплава характеризуется индивидуальным набором интерференционных максимумов, а также наличием слабых по интенсивности линий от  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub> и AgBr. Отжиг Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> в вакуумированном до давления  $\sim 1 \, \text{Pa}$  кварцевом контейнере выше 470 K вызывает его диссоциацию с образованием  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub>, AgBr и газовой фазы. Однако диссоциации соединения не наблюдается в среде аргона ( $P \approx 10^5 \, \mathrm{Pa}$ ) при многократном термоциклировании сплава в интервале температур 300-430 К. Цель настоящей работы — изучение равновесий фаз разреза Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub>-[(AgBr)<sub>4</sub>SnS<sub>2</sub>] в окрестности состава Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, установление условий синтеза соединения стехиометрического состава и исследование температурной зависимости его электропроводности.

### 2. Экспериментальная часть

Политермический разрез  $Ag_8SnS_6 - [(AgBr)_4 \cdot SnS_2]$ в области составов 35–100 mol.%  $Ag_8SnS_6$  исследован дифференциальным термическим (ДТА), рентгенофазовым (РФ), рентгеноструктурным (РС) и микроструктурным (МК) методами анализа. Сплавы для ДТА изготовляли прямым сплавлением элементов полупроводниковой чистоты в вакуумированных до остаточного давления ~ 1 Ра кварцевых ампулах. Масса навесок составляла 0.5 g. Погрешность измерения температур структурных превращений сплавов не превышала  $\pm 5$  К.

В качестве исходной шихты при синтезе Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> использовали тщательно перемешанные порошкообразные (размер частиц  $\sim 5 \mu m$ ) соединения Ag<sub>6</sub>SnS<sub>6</sub>, AgBr и SnS<sub>2</sub>. Диссоциация сплава выше 600 К подавлялась дополнительным введением в шихту серы и SnBr<sub>2</sub>. Экспериментально определенные их количества составляют 12 и 14 mg/cm<sup>3</sup> свободного объема ампулы соответственно. Вакуумированная до остаточного давления  $\sim 1$  Ра при 300 К смесь выдерживалась 24 h при температуре 700 К. Закалка материала от 670 К осуществлялась на воздухе со средней скоростью 45 K/min. Основная часть газовой фазы конденсировалась на стенке контейнера в виде элементарной серы, SnBr2 и жидкости с неопределенным соотношением серы, бромидов серы и олова. Сконденсированная на сплаве часть газовой фазы удалялась возгонкой в вакууме  $\sim 1$  Ра при 360 К. Однофазность полученного материала контролировалась ДТА, РФ- и МК-анализами. Закаленный материал, измельченный до размеров частиц ~ 5 µm, имеет темно-коричневый цвет. Многократное термоциклирование сплава в интервале температур 300-430 К при атмосферном давлении в среде аргона не вызывает его диссоциации. О свойстве суперионных фаз сохранять кристаллическую структуру за пределами температурного интервала их стабильности сообщается также в [7,8]. Полученный закалкой материал использовали для РФ-, РС- и электрических исследований.

При РФ- и РС-анализах массивы экспериментальных интенсивностей и углов отражений от поликристаллических образцов получали на автоматическом дифрактометре STOE STADY Р. Обработку дифракционных массивов, расчет теоретических дифрактограмм, рентгеновский профильный и фазовый анализы, определение и индицирование параметров элементарных ячеек проводили с помощью пакета программ STOE WinX<sup>POW</sup> (версия 2.21) [9] и PowderCell (версия 2.3) [10].

Электропроводность  $Ag_6SnS_4Br_2$ В интервале температур 210-380 К измерялась на постоянном токе зондовым методом в среде аргона при давлении  $\sim 10^5\, \text{Pa.}$  Использовали электрохимические ячейки двух типов: a) Ag/сплав/Ag с зондами Ag/сплав и b) Ag/Ag<sub>3</sub>SBr/сплав/Ag<sub>3</sub>SBr/Ag с зондами Ag/Ag<sub>3</sub>SBr/ сплав. Они служили для определения полной и ионной составляющих электропроводности сплава соответственно. Конструктивно ячейка представляет собой фторопластовую основу размером  $10 \times 10 \times 45 \, \text{mm}$ со сквозным по длине отверстием диаметром 2 mm. В отверстие впрессовывали составляющие ячеек до значений плотности  $\rho = (0.93 \pm 0.02)\rho_0$ , где  $\rho_0$  кристаллографическая плотность сплава. На боковой стороне ячеек, в центральной части, размещены три отверстия диаметром 0.8 mm на расстояниях 5 и 10 mm одно от другого. В них впрессовывали материал зондовых электродов. Длина сплава Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> в ячейках составляла  $\sim 33-35$  mm, слоев Ag<sub>3</sub>SBr  $\sim 3$  mm. Высота слоя Ag<sub>3</sub>SBr в зондовых контактах ~ 2 mm. Толщина серебра в токовых и зондовых электродах ~ 1 mm. Ячейки включали в электрическую цепь последовательно. Величина тока в цепи 5 · 10<sup>-8</sup> А. Входное сопротивление вольтметра более  $10^{10} \Omega$ .

### 3. Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлена исследованная нами Т-хдиаграмма разреза. Согласно полученным данным, на основе высокотемпературной модификации  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub> (черта над символом соединения означает твердый раствор на его основе) формируется широкая область твердых растворов. Максимальная растворимость достигается при 712 K и составляет  $\sim 69 \text{ mol.}\% \text{ Ag}_8 \text{SnS}_6$ . При этой температуре состав Ag<sub>7</sub>SnS<sub>5</sub>Br находится в пределах  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub>, т.е. не является соединением. Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> образуется при 712 К по перитектической реакции расплава с  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub>. Формульный состав тетрарного соединения определен построением Таммана. Необходимым условием образования Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> является давление газовой фазы в закрытом контейнере  $P > 10^5$  Pa. Нижняя граница температурного интервала существования соединения стехиометрического состава при введении в шихту серы и SnBr2 в указанных количествах составляет  $600 \pm 20$  К. Косвенным подтверждением правильности такой оценки является склон-



Рис. 1. Политермический разрез  $Ag_8SnS_6 - [(AgBr)_4 \cdot SnS_2]$ в области 35–100 mol.%  $Ag_8SnS_6$ . I - L;  $2 - L + + \alpha - Ag_8SnS_6$ ;  $3 - \alpha - Ag_8SnS_6$ ;  $4 - (\alpha + \beta) - Ag_8SnS_6$ ;  $5 - \beta - Ag_8SnS_6$ ;  $6 - L + \alpha - Ag_8SnS_6 \rightarrow Ag_6SnS_4Br_2$ ;  $7 - \alpha - Ag_8SnS_6 + Ag_6SnS_4Br_2$ ;  $8 - Ag_6SnS_4Br_2$ ;  $9 - L + Ag_6SnS_4Br_2$ ;  $10 - L + Ag_6SnS_4Br_2 + Ag_2SnS_3$ ;  $11 - L + Ag_6SnS_4Br_2 + Ag_2SnS_3 + AgBr$ .

ность материала к спеканию выше 600 К. Ниже 570 К порошкообразные сплавы не спекаются.

Результаты РФ-, РС-, ДТА и МК-анализов согласуются между собой в отношении образования нового тетрарного соединения  $Ag_6SnS_4Br_2$ . Кристаллическая структура  $Ag_6SnS_4Br_2$  принадлежит к собственному структурному типу, родственному  $Ag_6GeS_4Br_2$ : пространственная группа *Pnma*, a = 6.67050(10), b = 7.82095(9), c = 23.1404(3) Å, Z = 4. Соединение  $Ag_7SnS_5Br$  в системе не образуется.

Сопоставление результатов наших исследований с работами [6,11] показывает, что устойчивое состояние соединений  $Ag_6XS_4Z_2$  в структуре P-T-x-пространств осуществляется при давлениях  $P \ge 10^5$  Ра.

Исследованию электропроводности сплава Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> предшествовал его двукратный цикл нагрев-охлаждение в интервале температур 300–380 К в течение 5 h. В результате термической обработки устранялись дефекты, вызванные пластической деформацией прессования. Ограничение нагрева температурой 380 К обусловлено началом выше 400 К процесса электролиза сплава. В последующих циклах нагрев-охлаждение отношение  $[(\varphi - \varphi_2) \pm \varepsilon_{1-2}]/l_{1-2}$  сохраняется практически постоянным для каждой ячейки при конкретной температуре  $(\varphi_1 - \varphi_2, \varepsilon_{1-2} \ u \ l_{1-2}$  — разность потенциалов, электродвижущая сила поляризации и расстояние между двумя произвольно выбранными зондами соответствен-



**Рис. 2.** Температурная зависимость удельной электропроводности соединения  $Ag_6SnS_4Br_2$ . *1* — полная электропроводность, *2* — ионная составляющая электропроводности. На вставке — фрагмент дифференциальной термограммы нагрева сплава.

но). Различия в значениях указанного соотношения не превышают 2–3% и имеют флуктуационный характер. При соблюдении таких условий сопротивлением зондовых контактов в последующих расчетах пренебрегали.

Удельную электропроводность сплавов  $\sigma$  рассчитывали по закону Ома для неоднородного участка цепи. При этом исходили из экспериментальных значений величины тока в цепи, разности потенциалов, величины и знака эдс поляризации как функции температуры для трех расстояний между зондами ячеек.

Температурная зависимость полной электропроводности и ее ионной составляющей для Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> характеризуется изломом при 235 К (рис. 2). Для выяснения его природы проведен ДТА сплава при нагреве от азотных температур. Термограмма, часть которой приведена на вставке к рис. 2, также обнаруживает размытый в шкале температур излом с минимумом при 235 К. Изменение кристаллической структуры сплава сопровождается незначительным тепловым эффектом. Подобные процессы характерны для соединения Ag7GeS5I в окрестности 270 К и описаны в работе [2]. Совпадения температур изломов на кривых электпропроводности и ДТА сплава указывают на внутризеренный процесс переноса вещества и заряда. В работе [12] показано, что в высокотемпературных суперионных фазах поликристаллических халькогенидов меди с размерами зерен  $\geq 50\,\mu\text{m}$  ионная проводимость обусловлена в основном диффузией по внутризеренным каналам. В нашем случае указанный характер диффузии катионов серебра сохраняется преобладающим в зернах размером до 5 µm.

Температурные зависимости полной и ионной проводимостей сплава выше 235К имеют вид расходящихся

Физика твердого тела, 2010, том 52, вып. 2

кривых. Более высокий прирост  $\sigma$  обнаруживает сплав ячейки типа а. Это обусловлено возрастающим вкладом в полную электропроводность электронной составляющей. Отношение электропроводности ячеек b и а при 300 и 380 К оценены значениями чисел переноса 0.85 и 0.79 соответственно. В отдельном эксперименте в интервале температур 210-380 К нами исследована электропроводность ячейки с типа Ag/Ag<sub>3</sub>SI/Ag<sub>3</sub>SBr/сплав/Ag<sub>3</sub>SBr/Ag<sub>3</sub>SI/Ag с зондами Ag/ Ад<sub>3</sub>SI/Ад<sub>3</sub>SBr/сплав. Проводимости ячеек *b* и *c* совпадают. Таким образом, электронной составляющей проводимости соединения Ag<sub>3</sub>SBr в интервале температур 210-380 К, как и для соединения Ag<sub>3</sub>SI, можно пренебречь [13]. В интервале 250-380 К экспериментальные точки для удельной ионной компоненты проводимости соединения образуют прямую линию (рис. 2). Уравнение температурной проводимости зависимости имеет вид  $\sigma T =$  $= (3.15 \pm 0.05)10^5 \exp[-(0.175 \pm 0.005) \text{ eV/kT}]\text{K}/(\Omega \cdot \text{m}).$ Удельная электропроводность при 300 К составляет  $\sigma_{\rm ion} \approx 1.21 \, (\Omega \cdot m)^{-1}$ . Ниже 235 К соединению свойственна вполне ионная проводимость. Температурная зависимость электропроводности описывается уравнением  $\sigma T = (1.35 \pm 0.05) 10^{11} \exp[-(0.44 \pm 0.03) \text{ eV/kT}] \text{K}/(\Omega \cdot \text{m}).$ Высокая удельная проводимость и низкая энергия активации носителей тока Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> выше 235 K позволяют отнести соединение к классу суперионных проводников.

#### 4. Заключение

Установлено существование в системе Ag-Sn-S-Br соединения Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, обладающего суперионными свойствами. Соединение выделяется из расплава при 712К по перитектической реакции жидкости  $\alpha$ -Ag<sub>8</sub>SnS<sub>6</sub>. Условием выделения кристаллов с стехиометрического состава является давление газовой фазы в закрытом контейнере  $P \ge 10^5$  Pa. Кристаллическая структура соединения изменяется при 235 К. Твердофазный синтез соединения осуществлен из смеси  $Ag_8SnS_6 + SnS_2 + 4AgBr$  в предварительно вакуумированном до ~1 Ра кварцевом контейнере при 700 К с последующей закалкой на воздухе. Диссоциация сплава подавлялась дополнительным введением в шихту серы и SnBr<sub>2</sub> в количестве 12 и 14 mg/cm<sup>3</sup> свободного объема ампулы соответственно. Измерение электропроводности соединения проведено на постоянном токе на спрессованном порошкообразном материале с размерами частиц  $\sim 5\,\mu$ m. Ниже 235 К сплаву свойственна чисто ионная электропроводность. Уравнение температурной зависимости электро- $\sigma T = (1.35 \pm 0.05)10^{11}$ проводности имеет вид  $\times \exp[-(0.44 \pm 0.03) \,\mathrm{eV/kT}] \,\mathrm{K/(\Omega \cdot m)}.$ Выше 235 K наряду с ионной установлена электронная составляющая проводимости. Ионная проводимость в интервале температур 250–380 K описывается уравнением  $\sigma T =$ 

 $= (3.15 \pm 0.05)10^5 \exp[-(0.175 \pm 0.005) eV/kT] K/(\Omega \cdot m).$ Числа переноса при 300 и 380 K равны 0.85 и 0.79 соответственно. Массо- и электроперенос в Ag<sub>6</sub>SnS<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> осуществляется по внутризеренным каналам. Соединение Ag<sub>7</sub>SnS<sub>5</sub>Br в системе не образуется.

## Список литературы

- [1] A. Nagel, K.-J. Range. Z. Naturforsch 33b, 1461 (1978).
- [2] M. Laqibi, B. Cros, S. Peytavin, M. Ribes. Solid State Ionics 23, 21 (1987).
- [3] В.И. Михеев. Рентгенометрический определитель минералов. Госгеолиздат, М. (1957). 568 с.
- [4] A. Zerouale, B. Cros, B. Deroide, M. Ribes. Solid State Ionics 28–30, 1317 (1988).
- [5] R. Belin, A. Zerouale, A. Pradel, M. Ribes. Solid State Ionics 143, 445 (2001).
- [6] M. Wagener. Synthese, charakterisierung und strukturchemische aspekte von kupfer- und silberchalkogenohalogeniden sowie von halogeno- und oxochalkogenaten (IV). Ph.D. Thesis. University of Siegen (2005). 290 p.
- [7] T. Takahashi. J. Appl. Electrochem. 3, 79 (1973).
- [8] А. Вест. Химия твердого тела. Теория и приложения. Мир, М. (1988). Ч. 2. С 33.
- [9] Stoe WinX<sup>POW</sup>. Version 2.21. Stoe & Cie GmbH, Darmstadt (2007).
- [10] W. Kraus, G. Nolze. PowderCell for Windows (Version 2.3). Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin (1999).
- [11] M. Wagener, H.-J. Deiseroth, C. Reiner. Z. für Kristallographie 221, 533 (2006).
- [12] В.Я. Горбунов. Автореф. канд. дис. Свердловск (1986). 20 с.
- [13] Ю.Г. Власов, Ю.Е. Ермоленко, Б.А. Николаев. Электрохимия 17, 1448 (1981).